# 電気機械センサーとしての カーボンナノチューブの応用

NASAエイムズ研究センターの研究者達は、原子的レベルで 鋭い先端を持つAFMチップによるナノチューブの2種類の変 形:(1)曲げと(2)押しでの結合性の違いを調べるため に、BIOVIA社MS ModelingのDMol<sup>3</sup>を使用ました。

このような研究は、最小の機械的変化も検出できる超高感度 なセンサーのより良い設計を可能にすると同時に、カーボン ナノチューブをベースとした新しいタイプの歪みゲージのデ ザインを可能にします。



図1 DMol<sup>3</sup>で緩和させた(a):(6,6)アームチェアー(132炭 素原子)、および(b):(12,0)ジグザグ型(144原子)のLiチ ップで変形させたクラスター。変形角はどちらも25°。(c)、( d)はナノチューブの軸方向からの図。sp3配位が無いこと を明確に示している。チューブの他の部分は古典的力場計 算で表現されているが、ここでは分かり易くするために表示 していない。

近年カーボンナノチューブは、商業用途での利用を現実的に 可能にするような多くの実験上の革新的成果に支えられ、ホ ットな研究活動対象になりました。例えば、電界放射型フラ ットパネルディスプレイ、マイクロエレクトロニクス分野に おける新しい半導体デバイス、水素貯蔵デバイス、化学セン サー、そしてごく最近になって注目されはじめた超高感度電 気機械センサーなどへの応用です。

電気化学センサーの開発に関する重要な実験には、長さが 600nmの溝の上方に吊した金属ナノチューブが使われまし た。このような懸垂ナノチューブの中心部をProducts DMol<sup>3</sup> Organization NASA原子間力顕微鏡 (AFM)の先端で押す と、伝導率がほぼ2桁低下することが分かりました[1]。この 伝導率低下は、機械的な拘束下で曲げられたチューブに対し て、以前に計算によって予測されていた値より、はるかに大 きなものでした。O(N) –タイトバインディング計算によ り興味ある説明がなされましたが、それはある臨界変形量を 超えるとAFMチップ近傍の数個の炭素原子がsp3配位に なると言うことを示したものでした。これはn-電子を局在 化した $\sigma$ -状態にするということで、電気伝導率の大きな低

### Organization NASA

## Products BIOVIA Materials Studio DMol<sup>3</sup>

### 下を説明するものでした。

この考えを検討するために、第一原理DFTコードのDMol<sup>3</sup> を用いて、原子レベルで鋭い先端をもつAFMチップによる (1)曲げと(2)押しでのナノチューブの変形での結合状 態の違いが検討されました。このようなシミュレーションで は、最小のモデルでも数千原子が必要となり単純なDFT計 算では容易ではありません。このため、研究者達はDFTと 古典的分子力場計算を組み合わせて使用しました[2,3]。結 合の組み替えが起こるとすれは、チューブ中央部の大変形領 域でのみ起こるだろうと考えられ、この原子(AFMチップ の原子を含め、およそ100-150原子)についてはDFT を適用、また、中央部分から離れた長く、ほぼ直線と考え られる部分はUniversal力場(UFF)により正確に記述されまし た。

この計算により解ったことは非常に興味深いもので す:AFMで押したチューブではsp3配位は起こりません でした(図1)チューブは伸長され、ある種のキラリティ ー、例えば金属的なジグザグ型チューブではエネルギーギャ ップを発生させます[3,4]。この説明は非平衡Green関数表式 (NEGF)に基づく、タイトバインディング電子移動計算に よって支持されました[3]。

その後の実験[5]により上記の理論的解釈は確認され、ナノ 技術によるカーボンナノチューブを使った新しいタイプの歪 みゲージや圧力センサーの設計探索が促進されました[6]。

NASAエイムズ研究センター(米国カリフォルニア州モフェ ット・フィールド)のナノテクノロジーグループと現在進行 中の共同研究は、近い将来、もっと興味深い結果をもたらす ものと期待されています。

この計算科学の成果(参考文献[3])は、2002年 度、NASA-CACの応用科学部門、最優秀論文賞を受賞しました。

### 参考文献

- 1. T.W.Tombler et al., Nature, 2000, 405, 769.
- 2. A. Maiti, Phys. Stat. Sol. B, 2001, 226, 87.
- 3. A. Maiti, A. Svizhenko, and M. P. Anantram, Phys. Rev. Lett., 2002, 88, 126805.
- 4. A. Maiti, Nature Materials (London), 2003, 2, 440.
- 5. E. D. Minot et al., Phys. Rev. Lett., 2003, 90, 156401.
- 6. J. Cao, Q. Wang, and H. Dai, Phys. Rev. Lett., 2003, 90, 157601.